

日本分析化学会 X線分析研究懇談会第266回例会

協賛：シンクロtron光利用者研究会

日本分析化学会 X線分析研究懇談会 委員長
辻 幸一

平素より本研究懇談会へのご協力をありがとうございます。

下記のとおり、X線分析研究懇談会第266回例会を開催いたします。今回は、放射光X線を用いた研究の講演に加え、「あいち産業科学技術総合センター」の計測・分析設備および「あいちシンクロtron光センター」の見学も行います。

懇談会会員・非会員を問わず、多くの方のご参加をお待ちしております。

記

1. 日時：2019年1月22日(火)13:00～16:00
2. 場所：あいち産業科学技術総合センター 1F 講習会室A
愛知県豊田市八草町秋合1267-1（東部丘陵線 リニモ「陶磁資料館南」駅 正面）
アクセスは裏面を参照ください。
3. プログラム：
講演1 <13:00～13:30> 福岡 修（あいち産業科学技術総合センター）
X線トポグラフィ技術を用いた単結晶基板の広範囲欠陥観察（あいちSR-BL8S2）
講演2 <13:30～14:00> 井田 隆（名古屋工業大学 先進セラミックス研究センター）
通常光源とシンクロtron光源を用いた粉末X線回折
講演3 <14:00～14:30> 吉田 朋子（大阪市立大学 複合先端研究機構）
機能性材料キャラクタリゼーションへのXAFS応用（あいちSRでの測定結果を中心に）
講演4 <14:30～15:00> 飯原 順次（住友電気工業(株) 解析技術研究センター）
住友電工の放射光利用の現状
－休憩－<15:00～15:15>
見学会 <15:15～16:00>
あいち産業科学技術総合センター・計測分析室／あいちシンクロtron光センター
4. 参加費：無料
参加ご希望の方は、**2019年1月18日(金) までに** メールにてご連絡をお願いします。
メールの件名は、「266回例会」としてください。

問い合わせ・参加申し込み先：

あいちシンクロtron光センター 上原 康 (E-mail: uehara@astf.or.jp)

<「知の拠点あいち」 アクセス案内図 >



鉄道：「名古屋」－(地下鉄東山線)→「藤が丘」－(東部丘陵線リニモ)→「陶磁資料館南」
「陶磁資料館南」駅出口から道路を挟んで正面が、「知の拠点あいち」正門です。
(名古屋駅から約50分)